

Détection des défauts en tomographie X pour la fabrication additive métallique

Influence de la composition du matériau, de l'épaisseur et de la résolution

Julien LESSEUR

julien.lesseur@irt-saintexupery.com

COMET MAT CND : détection d'endommagement et suivi en fabrication 30 Novembre 2021

© IRT Saint Exupéry • All rights reserved • Confidential and proprietary document

Travaux réalisés dans le cadre du projet IRT ANDDURO

Introduction



- Fabrication additive (FA) métallique → génération de pièces à géométries complexes souvent difficiles à contrôler
- La tomographie X → moyen de contrôle non destructif 3D des défauts internes qui est de plus en plus utilisé en FA
- Technique employée principalement sur deux catégories de pièces :
 - Eprouvettes : Analyses à l'échelle locale pour la compréhension des relations microstructure / propriétés physiques (R&D)







rélèvement rut de fabrication



р

• Partiels de pièces / pièces complètes : scan globaux pour conformité CAO / détection de pores, inclusions... (Industriel)







Coupe tomographique (60 µm/voxel)



- La détection des défauts en tomographie est grandement limitée par :
 - La taille de la pièce et l'épaisseur cumulée de matériau à traverser
 - La composition chimique du matériau

FRENCH INSTITUTES OF TECHNOLOGY

4/12/202

 \rightarrow Connaître et évaluer l'influence de ces facteurs est donc primordial

3

Objectifs de l'étude



Evaluer l'influence de l'épaisseur et de la composition chimique du matériau sur la détection de pores

Tomographie X : technique en transmission sensible à la composition chimique Ju matériau (↗ numéro atomique ► ↘ taux de transmission) et à son épaisseur.



La résolution spatiale définit le niveau de détail observable par le système. Elle varie avec la taille du point focal du tube, la qualité de la reconstruction et le niveau de bruit des images produites.

- Conception d'éprouvettes contenant 10 défauts artificiels classés par taille.
- ► Géométrie brute de fabrication cylindrique pour améliorer l'acquisition.



Essais sur deux types de matériaux classiquement utilisés : alliage de titane Ti64 et alliage 718.

► Trois diamètres (5 mm, 15 mm, 25 mm) : évaluation de la détectabilité en fonction de l'épaisseur cumulée.





Tomographie X : principe de fonctionnement

14/12/2021

р а

g

e

Principe de transmission du signal en tomographie X





© IRT Saint Exupéry • All rights reserved • Confidential and proprietary document

 $\implies \text{Intensité I avec } I = I_{\Omega} e^{-\mu L}$

*NG : Niveaux de Gris

Le coefficient d'atténuation linéique μ est propre à chaque matériau En radiographie : *NG ≈ f(Epaisseur L, Numéro atomique, E_{photons}) **En tomographie** : reconstruction d'une cartographie 3D de $\mu \rightarrow$ même NG pour un même matériau (théoriquement)



Radiographie X d'une pièce aluminium avec inserts aciers (RX SOLUTIONS)

р а g e

Effet de l'épaisseur cumulée sur la qualité d'images



___5_mm ___15_mm ___25_mm

700000 e 6 Eprouvettes Alliage 718 600000 Pore? 500000 Pores Intensity (Nb pixels) 000000 000000 Mauvais taux de transmission (25 mm) 15 mm 5 mm 25 mm Taux de transmission faible (15 mm) RSB: 3.50 RSB: 1.19 RSB: 0.55 200000 Tension d'accélération : 230 kV Voxel size: 20 µm 100000 \rightarrow Le niveau de bruit augmente avec Bonne transmission (5 mm) l'épaisseur 0 4/12/2021 \rightarrow La détection des pores diminue 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 Dynamic (16_bits) FRENCH INSTITUTES OF TECHNOLOGY fit

© IRT Saint Exupéry • All rights reserved • Confidential and proprietary document

p a g

RSB : Rapport Signal /Bruit

Influence du niveau bruit sur la détection des pores





Réduction du bruit → meilleur détection des plus fines structures / contraste

p a g e

7



chimique dans l'alliage



Résolution spatiale et taille de voxel

а g e

8

р

Mesurer la résolution d'un système tomographique



- Outils de contrôle : la mire JIMA
 - Des patterns (lignes) en tungstène générés par photolithographie sont disposés horizontalement et verticalement sur un film de silice
 - Une radiographie est réalisée pour vérifier la résolution du tube. Si les lignes sont discernables, la résolution est correcte
 - Limite de résolution : de 0,1 μm à 10 μm

Vérification simple et ajustement en temps réel

Résolution 2D uniquement / contraste parfois faible







INSTITUTES JA

p a g

e

Mesurer la résolution d'un système tomographique



- Outils de contrôle : la mire QRM
 - Des patterns 3D sont gravés sur deux supports en silicone disposés horizontalement et verticalement et enrobés dans un cylindre plastique
 - Une tomographie du cylindre est réalisée : si les lignes sont identifiables, la résolution spatiale en **reconstruction tomographique** est atteinte

2 µm

Limite de résolution : de 1 µm à 10 µm







Résolution 3D réelle

Nécessite une acquisition tomographique > 1h Moins adapté à la haute énergie (faible contraste) INSTITUTES OF TECHNOLOGY

QRM avec cathode LaB6 2 µm, 3 µm 1 µm 4 µm

 $4 \,\mu m$

QRM avec cathode W



8 µm

10 um

р а g

e

En résumé



Un bon réglage des éléments constituant la chaîne d'acquisition et de traitements ne garantit pas la détectabilité des défauts les plus fins

□Facteurs limitants :

- ➢ Epaisseur cumulée trop importante → Signal transmis faible et niveau de bruit trop élevé





Mise en application



Eprouvettes Ti64 et Alliage 718 fabriquées par Laser Beam Melting (LBM) Création de 10 défauts artificiels cylindriques centrés pour préserver l'effet de l'épaisseur Diamètres de 500 à 50 µm

Model CAO



d'éprouvette

4/1

р

а

g e

Mise en application





Fixation des paramètres d'acquisitions tomographiques adaptés à la composition des échantillons, la géométrie et aux défauts recherchés

Matériaux	230 kV	300 kV	450 kV	
Ti64	20 mm	25 mm	> 30 mm	
Alliage 718	10 mm	15 mm	> 20 mm	
IRT µCT	\checkmark	X	X	

Valeurs théoriques

*FS: Focal Spot

p a

14/12/2021

Taille de voxel de 20 μm	Taille de voxel de 5 µm		
Scan global	Scan local (sauf diamètre 5 mm)		
Tension maximale (230 kV)	Tension maximale (230 kV)		
Power 20 W \rightarrow 20 μ m *FS size	Power 6.9 W \rightarrow 5 µm *FS size		
Seuil théorique de détection Deq= 0.050 mm	Seuil théorique de détection Deq= 0.012 mm		
Même temps d'acquisitions	Temps d'acquisition selon la dynamique de l'image		



IRT µCT system (230 kV)

Eprouvettes Ti64

a de

Thin.

1984

륲





FRENCH INSTITUTES OF TECHNOLOGY

fit







Diamètre 25 mm

SAINT XUPÉRY

5







Le bruit dans l'image devient très présent. La segmentation des pores est plus complexe mais la détection est encore précise.

Eprouvettes Ti64



Effet de l'épaisseur sur la détection des défauts



Les 10 pores sont détectés pour tous les diamètres. Les pores de plus de 200 µm sont détectés pour l'épaisseur cumulée la plus grande (25 mm) à la plus faible résolution (20 µm).

р а

g



Eprouvettes Ti64



Mesure des effets de la résolution sur la taille de pore



Les scans basse résolution ont tendance à la surestimation → La haute résolution est utile pour une description très précise des géométries de défauts et à la détection des plus petits

р а

g e







-		/ -	
)	mm	15	um
/			MILL

	5 mm		15 mm		25 mm	
Résolution	20 µm	5 µm	20 µm	5 µm	20 µm	5 µm
Temps de scan	1h	3h30	1h	12h30	1h	NA



р а g

e

1 9

р

14/12/2021







[mm]

Image brute

Image filtrée



14/12/2021

p a g

e

2

 Un post-traitement très poussé est nécessaire pour réduire le bruit et détecter les pores. La segmentation est très peu précise.

 $\ensuremath{\mathbb C}$ IRT Saint Exupéry • All rights reserved • Confidential and proprietary document

Effet de l'épaisseur sur la détection des défauts





Les défauts construits dans l'alliage 718 sont plus petits que les défauts dans le Ti64.
L'augmentation de l'épaisseur cumulée gêne la détection des pores < 200 µm.
Les pores < 200 µm sont uniquement détectés avec la haute résolution.
→ Doutes sur la construction des deux plus petits pores (9 et 10).

р

а



Eprouvettes Alliage 718 Mesure des effets de la résolution sur la taille de pore





Les scans basse résolution ont tendance à la surestimation

La tendance se réduit en augmentant le diamètre (bruit de fond plus élevé, précision moins fiable) → La haute résolution est utile pour les plus grandes épaisseurs cumulées mais n'est en pratique que peu applicable

р

a g e



Conclusions



70% density

Aletheia Spatial target Patent Pending (2103323.8)

© Aletheia imaging

 La tomographie X haut énergie (230 kV) offre une bonne détection des défauts dans des alliages métalliques communs.

Ti64:

- Bonne détection possible à haute et basse résolution pour les épaisseurs jusqu'à 25 mm
- Les temps de scans sont raisonnables pour un seuil de détection théorique > 50 µm

Alliage 718 :

- Détection complexe dès 15 mm d'épaisseur cumulée voir impossible au-delà de 25 mm
- Haute résolution nécessaire pour les pores < 200 µm
- Temps de scans importants → incompatible avec des besoins de scans récurrents

Aletheia Spatial target Patent Pending (2103323.8)

- Différences de détection entre les deux alliages nettes malgré des paramètres similaires
 - Influence forte de la nature du matériau sur la détection des défauts
 - ➤ Améliorations possibles par l'utilisation de tubes 300 kV et plus capables de travailler à des résolutions élevées (préservation d'un point focal petit) → meilleur pénétration et meilleur RSB

• Pour aller plus loin?



- Influence de la morphologie des défauts (défauts plans, fissures...) ?
- Développement d'outils 3D « calibrés » pour différentes familles de matériaux
- enant compte des incertitudes liées à la mesure tomographique
- Mesures des performances (détection) et suivi machine

14/12/2021





Merci de votre attention !